

1. Record Nr.	UNINA9910694816803321
Titolo	AFM-based microelectrical characterization of grain boundaries in Cu (In,Ga)Se thin films [[electronic resource] /] / C.-S. Jiang ... [and others]
Pubbl/distr/stampa	Golden, Colo. : , : National Renewable Energy Laboratory, , [2005]
Descrizione fisica	1 volume : digital, PDF file
Collana	Conference paper ; ; NREL/CP-520-37338
Altri autori (Persone)	JiangC.-S (Chun-Sheng)
Soggetti	Thin films - Electric properties
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from title screen (viewed on Mar. 27, 2006). "February 2005."